



Adlershof. Science at Work.

Tagungsbeiträge / Anmeldung

Die Anmeldung zur PRORA 2017 erfolgt ausschließlich über das Onlineformular auf iap-adlershof.com

Sie haben die Möglichkeit, im Abstract-Book eine Anzeige zu schalten. Andere Unterstützung und Sponsoring sind gern willkommen. Sprechen Sie dazu mit unserem Organisationskomitee.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Teilnahmekosten

200,00 € / Studenten 55,00 €

Ausstellungsfläche

Miete 150,00 €/m²

Hotelreservierung

Die Buchung von Hotelzimmern ist bis zum 2.11.2017 zum Vorzugspreis möglich (siehe Tabelle).

	Dorint Adlershof	airporthotel Adlershof
EZ	90,00 €/N.	64,00 €/N.
DZ	108,00 €/N.	79,00 €/N.
Frühst.	inkl.	13,00 €/p.P.

Rahmenveranstaltung

Besonders hingewiesen wird auf das Satellite-Meeting des Berlin Laboratory for X-ray Technologies (BLIX) und das anschließende Stiftertreffen an der TU Berlin am 29.11.2017.

Organisation und Korrespondenzanschrift

A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92-65 09
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
E-Mail: info@iap-adlershof.de

Veranstalter

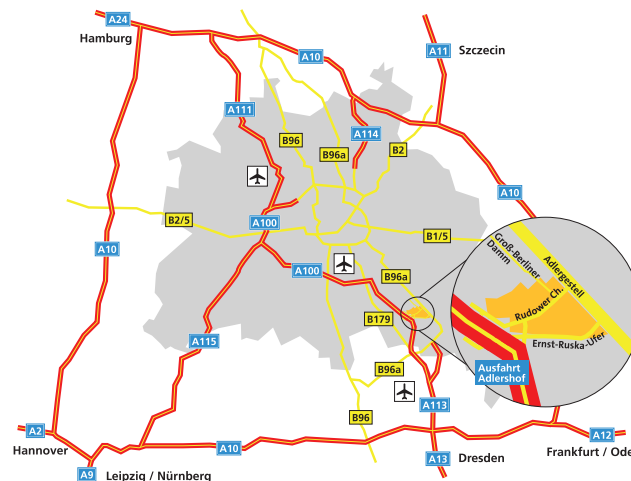
IAP Institut für angewandte Photonik e.V., Berlin
Helmut Fischer GmbH, Institut für Elektronik und Messtechnik, Standort Berlin
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Bruker Nano GmbH, Berlin
Helmut Fischer Stiftung, Stuttgart
Optec-Berlin-Brandenburg e.V.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin
Arbeitskreis Prozessanalytik SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Kleve
Technische Universität Berlin
WISTA-MANAGEMENT GMBH
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

PRORA® ist eine eingetragene Marke des IAP e.V.

Anfahrtsskizzen auch unter www.adlershof.de

Programmkomitee

B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, Helmut Fischer GmbH, Standort Berlin
F. Emmerling, BAM, Berlin
N. Esser, ISAS, Berlin
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg
E. Gerndt, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
B. Kanngießer, TU Berlin
A. Kharchenko, PANalytical B.V., Almelo, Niederlande
M. Krumrey, PTB, Berlin
F. Lerch, OpTecBB, Berlin
M. Maiwald, BAM, Berlin
H. Miersch, SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Kleve
M. Ostermann, BAM, Berlin
U. Panne, BAM und HU Berlin
P. U. Pennartz, Rigaku Innovative Technologies
K. Schickhoff, IAP e.V., Berlin
Th. Schülein, Bruker Nano GmbH, Berlin
H. Stiel, MBI, Berlin
U. Waldschläger, Bruker Nano GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP e.V., Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH, Geesthacht



Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

30. November – 1. Dezember 2017

WISTA – Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Haus 8.05
Richard-Willstätter-Straße 11
12489 Berlin

DO 30 NOV

08:30–09:30	Anmeldung
09:30–09:45	Eröffnungsworte
09:45–10:30	Keynote F. Emmerling, BAM (E) Licht ins Dunkle – in-situ-Untersuchungen mechanochemischer Reaktionen
10:30–10:55	J. Heckel, SPECTRO GmbH (E) Schneller und Richtiger?
10:55–11:15	B. Beckhoff, PTB Characterization of advanced materials at the nano- and microscales by X-ray spectrometry using calibrated instrumentation
11:15–11:35	M. Wansleben, PTB Characterization of a compact and calibratable von Hamos X-ray spectrometer based on full-cylindrical HAPG mosaic crystals
11:35–11:55	D. Büchele, BAM Herausforderungen bei der Quantifizierung von Nährstoffgehalten in Böden mittels RFA
11:55–12:15	T. Stalinski, GFal e.V. A novel configurable mineral classifier based on X-ray fluorescence fundamental parameters
12:15–13:25	Mittag
13:25–13:55	S. Scheller, Bruker Nano GmbH (E) Process Mineralogy: Characterizing Mineral in Uncrushed Rock and Drill Cores using Micro-XRF
13:55–14:15	D. Defoy, Claisse Malvern PANalytical Uses Automation for Sample Preparation by Fusion
14:15–14:35	R. Schramm, Fluxana GmbH & Co KG Erfahrungsbericht über den Einsatz platinfreier Tiegel im elektrischen Schmelzaufschluss
14:35–14:55	J. Flock, Thyssen Krupp AG Automation der Röntgenfluoreszenzanalyse – vom Schmelzaufschluss bis zur Auswertung
14:55–15:15	Kaffee

15:15–15:35	M. Scheiner, IAP e.V. ProRec – ein kompaktes Analysemodul zur schnellen und hoch orts aufgelösten Stofferkennung mit Röntgenfluoreszenz für den Einsatz in Recycling und Rohstoffaufbereitung
15:35–15:55	I. Kamleitner, Helmut Fischer GmbH Micro spot XRF measurement of lead frames
15:55–16:15	M. Zoontjes, PANalytical B.V. On-line X-ray fluorescence spectrometer for accurate monitoring and improving blending sharpness in liquid production processes
16:15–16:30	Kaffee
16:30–16:50	T. Gerhardt, GNF e.V. MnO_x-Katalysatoren für die CO-Oxidation bei niedrigen Temperaturen in der Luft
16:50–17:10	B. Arlt, Anton Paar GmbH New Developments in Laboratory SAXS Instruments
17:10–17:30	J. Wiesmann, Incoatec GmbH New developments in microfocus sources for X-ray diffraction
17:30–18:30	Postersession
18:30–19:00	Pause
19:00–22:00	Abendveranstaltung und Verleihung des Helmut Fischer Posterpreises

FR 1 DEZ

09:00–09:20	Ch. Schlesiger, TU Berlin XAFS by an X-ray tube based laboratory spectrometer
09:20–09:40	Zhong Yin, MPI Göttingen und DESY Novel Soft X-ray Spectrometer based on RZP for RIXS Studies
09:40–10:00	C. Zech, PTB In-operando near sulfur K-edge X-ray absorption spectrometry of Li-S battery coin cells
10:00–10:20	Kaffee

10:20–10:40	L. Bauer, TU Berlin Confocal Micro-X-ray Fluorescence spectroscopy with a Metal Jet Source
10:40–11:00	C. Streeck, PTB Untersuchung flüchtiger organischer Komponenten mittels Röntgenabsorptionsspektrometrie in einer in situ-Gaszelle
11:00–11:20	M. Krämer, AXO DRESDEN GmbH New developments and application examples of ultrathin layered XRF reference samples
11:20–11:40	A. Erko, HZB Femtosecond Modular X-ray Spectrometer-Monochromator, Conceptual Study
11:40–12:00	A. Zierau IAP e.V. Homogeneity evaluation of dispersed particles in polymer matrices
12:00–13:10	Mittag
13:10–13:40	L. Strüder, PNSensor GmbH (E) Quantitative Messungen zum Nachweis ionisierender Strahlung mit ortsauflösenden spektroskopischen Halbleiterdetektoren
13:40–14:00	A. Pahlke, KETEK GmbH Silizium Drift Detektoren der neuesten Generation
14:00–14:20	T. Elsässer, MBI Neue Laborquellen für ultrakurze harte Röntgenimpulse und Anwendungen in der Festkörperphysik
14:20–14:40	Kaffee
14:40–15:00	S. Haaga, Bruker AXS GmbH XRD Anwendungen mit neuester Quellen- und Detektortechnologie
15:00–15:20	P. Pennartz, Rigaku Innovative Technologies, Inc. X-ray Optics for an Optimized Performance Between 10 eV and 40 keV Energy Range
15:20–15:40	A. Sondag SmarAct GmbH Vorstellung eines Positionier-Systems der SmarAct GmbH
15:40–16:00	Abschluss